

基于 Yield 来构建一个基本的缺陷预测模型，假设

- 上述阶段分别为需求开发、需求评审、设计、设计评审、编码、测试；
- 需要基于该模型预测最终产出物中有多少个缺陷？

讨论

- 1. 需要补充哪些数据？请设计一个可行的数据获取要求；
- 上述数据显然不可能是一个恒定不变的数据，该如何处理？

